

サンビーム共同体発表

番号	企業・団体名	発表者(代表)	タイトル(仮題含む)
S01	川崎重工業(株)	中山耕輔	XAFSを用いたNi-MH電池正極材料の評価
S02	川崎重工業(株)	清瀧 元	モーターサイクル用排ガス浄化触媒の劣化機構の解明
S03	(株)神戸製鋼所	稲葉雅之	鉄鋼材料を対象としたSR利用その場測定取り組み
S04	住友電気工業(株)	上村重明	放射光X線回折実験によるBi系超電導線材の評価
S05	ソニー(株)	越谷直樹	ペンタセン薄膜のX線回折法による構造解析
S06	関西電力(株)	出口博史	二酸化炭素を吸収したアミン水溶液のX線散乱解析
S07	(財)電力中央研究所	野田直希	排ガス中ガス状セレン測定法の規格化に関する検討
S08	(株)東芝	沖 充浩	XAFSによる工業材料中六価クロムの定量分析
S09	(株)豊田中央研究所	山口 聡	高エネルギーX線を用いた残留応力解析
S10	日亜化学工業(株)	榊 篤史	放射光マイクロX線による蛍光体フリー白色LEDの評価
S11	日亜化学工業(株)	吉田泰弘	in-situ XAFS/XRD測定によるLi二次電池正極材料の構造解析
S12	日産自動車(株)	伊藤淳史	高容量Li-ion電池用正極のIn-situ技術を適用した局所構造解析
S13	パナソニック(株)	尾崎伸司	Si基板上汚染金属の化学状態分析
S14	(株)日立製作所	上田和浩	X線磁気顕微鏡の開発
S15	(株)富士通研究所	淡路直樹	領域拡大フーリエ変換ホログラフィーイメージング法の開発
S16	三菱電機(株)	河瀬和雅	ラジカル改質されたCVD-SiO ₂ 膜のX線反射率による密度評価
S17	三菱電機(株)	上原 康	XANESによる銅と絶縁油の反応解析
S18	(株)神戸製鋼所	北原 周	サンビームのX線回折装置
S19	(株)東芝	吉木昌彦	サンビームのXAFS装置
S20	(株)日立製作所	米山明男	サンビームのイメージング